

Mittwoch, 7. Oktober 2009

9:00 – 10:00	Begrüßung: Michael Dams, Director Central Europe, National Instruments Keynote: Prof. Dr. Marion Schick, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft				
10:00 – 10:30	Kaffeepause / Besuch der Ausstellung				
	Mess- und Prüftechnik	Prüfstandsautomatisierung	Automatisierungstechnik – PAC	Robotik & Mechatronik	Embedded
10:30 – 11:00	Der ideale Messbus? H. Illig, National Instruments	Ein neuer Standardtester mit flexiblem, skalierbarem Tester-Konzept auf Basis PXI und TestStand im Hause Miele EC Werk T. Ziems, Miele & Cie. KG M. Solbach, NOFFZ ComputerTechnik GmbH	Neuheiten und Live-Demos der NI-PAC-Produktplattform K. Dinnes, A. Scholz, National Instruments	Fit for Mechatronics? – Status quo!: Status der mechatronischen Reife in der Automatisierungswelt Dr. R. Stetter, ITQ GmbH	Vom Prototyping bis zur Serienfertigung mit der NI-Plattform S. Ahrends, National Instruments
11:00 – 11:30	Entwurf und Aufbau eines interaktiven Testsystems zur Durchführung von Hochgeschwindigkeitsmessungen an einem Etikettenappliziersystem Prof. N. Dahmen, Hochschule Niederrhein G. Fröhlich, Espera-Werke GmbH Duisburg	Prototyping eines universellen ISM-Band Transmitters auf Basis des NI FlexRIO MDK A. Weidel, Fachhochschule Lübeck C. Landmann, National Instruments		Programmierung von DENSO Robotern mit NI LabVIEW – Live-DEMO und Kundenlösungen A. Kempf, DENSO EUROPE B.V.	High-Speed-Laser-Steuerung durch elektrooptisches Modulator-Array (EMA) M. Bülters, Universität Duisburg-Essen
11:30 – 12:00	Erfassung der Zielbewegung im Biathlon-Schießen Prof. Dr. A. Baca, P. Kornfeind, Universität Wien	Prüfung elektronischer Komponenten mit drahtlosen Kommunikationsfunktionen Dr. G. Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH	Deterministische Ethernet-Anbindung für PAC-Systeme J. Kurpat, COMSOFT GmbH	Rapid Prototyping für Robotik- und Automatisierungsanwendungen M. Schmid, Schmid Engineering AG	Entwicklung eines Systems zur Prozessregelung beim Spritzgießen durch Kombination von grafischer Programmierung in LabVIEW mit textbasierten Algorithmen A. Schreiber, RWTH Aachen
12:00 – 12:30	Verarbeitung von Daten und Online-Fehlerdiagnose an Rotorprüfständen unter Berücksichtigung von Echtzeit- und Nicht-Echtzeitanwendungen B. Hasch, Technische Universität Darmstadt	Kombinatorisches Compoundieren und mechanische Online-Prüfungen an Folien R. Schwebel, J. Barth, Deutsches Kunststoff-Institut	Automatisierung kompletter Kühlanlagen mittels LabVIEW und PAC-Systemen Dr. A. Rzezacz, AMC – Analytik & Meßtechnik GmbH Chemnitz	Digital Prototyping mit SolidWorks und LabVIEW C. Fritz, National Instruments	Steuerung und Regelung einer Freiflug-Kammer mit LabVIEW FPGA und CompactRIO Dr. J. Hilsmann, measx GmbH & Co. KG B. Nebe, Indoor Skydiving Germany GmbH
12:30 – 14:00	Mittagsbuffet / Besuch der Ausstellung				
14:00 – 15:00	Keynote: Rahman Jamal, Technical Director Central Europe, National Instruments Live-Demonstrationen neuer Technologien und Produkte aus dem R&D-Center von National Instruments				
15:00 – 15:30	Kaffeepause / Besuch der Ausstellung				
	Mess- und Prüftechnik	Prüfstandsautomatisierung	Automatisierungstechnik – PAC	Messdatenverwaltung und -auswertung	Embedded
15:30 – 16:00	Anlagensteuerung und Messdatenerfassung mit LabVIEW und einem PXI-System zur Untersuchung von halbleiterbasierten Spinfiler-Kaskaden J. Jacob, Universität Hamburg	Flexibles Konzept eines Kombi-Testsystems T. Reichelt, HEITEC AG	CompactRIO für die Zustandsüberwachung von Windkraftanlagen C. Pritzkow, IMA GmbH Dresden	Minimierung von Aufwand und Kosten bei der Datenauswertung durch Lösungen basierend auf Standardsoftware A. Haub, National Instruments	Time to Market genügt nicht – langfristig planen, kurzfristig realisieren H. Taubert, Zühlke Engineering GmbH
16:00 – 16:30	Achsbezogene Erfassung der Antriebsleistungen in Abhängigkeit der Prozessparameter beim Drehen H. Rose, Technische Universität Chemnitz	Intelligentes Switch Management N. Brand, National Instruments	Einsatz industrieller Bildverarbeitung zur 3D-Objekterfassung und online Bewegungssteuerung eines 2-Achsen-Positioniersystems B. Kolb, F. Bätz-Oberhäuser, Hochschule Coburg	DIAdem als maßgeschneidertes Reportgenerierungstool für Tunnelbohrmaschinen M. Handler, M. Sagmeister, BEKO Engineering & Informatik AG	Modulares Testsystem basierend auf NI Single-Board RIO H. Kiehlm, Kiehlm Datenmanagement GmbH
16:30 – 17:00	Neuheiten der NI-Mess- und Testplattform und deren praktische Anwendung J. Bauer, National Instruments	Standardisierung von Schnittstellen-systemen für den Test elektronischer Baugruppen- und -komponenten M. Seipolt, MIC – Mass Interface Connections GmbH, M. Gschlößl, Conti Temic microelectronic GmbH	Analoge vs. digitale Drehzahl- und Vorschubregelung an Werkzeugmaschinen S. Kamps, WZL RWTH Aachen	FEVALYS - Ein neues Hilfsmittel zur effizienten Versuchsdatenauswertung in der Motorenentwicklung M. Salmen, FEV Motorentechnik GmbH	Objektorientierte Bibliothek für Test- und Prototyping-Anwendungen in Geldautomaten T. Tegetmeyer, Wincor Nixdorf International GmbH
17:00 – 17:30		Phasensynchroner FPGA-Pulsgenerator für Particle-Image-Velocimetry Messungen an rotierenden Maschinen mit stark schwankender Drehzahl W. Förster, DLR – Institut für Antriebstechnik	Verteilte CompactRIO-Messsysteme im Projekt Powerfluid Dr. G. Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH U. Flemig, Friedrich Grohe AG	Stromverbrauchreduzierung in Fahrzeugen durch automatisierte Auswertung von CAN-Daten aus Fahrversuchen H. Müller, a-solution GmbH	Dynamisches Testen von Komponenten und Embedded-Systemen in Echtzeit B. Toth, National Instruments Dr. H. Stahl, ExpertControl GmbH
ab 17:30	HAPPY HOUR im Ausstellungsbereich				

Begrüßung: Michael Dams, Director Central Europe, National Instruments
Keynote: Prof. Dr. Marion Schick, Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft

9:00 – 10:00

Kaffeepause / Besuch der Ausstellung

10:00 – 10:30

Automotive	Schall- und Schwingungsanalyse	Komponenten- und Baugruppentest	Hands-On-Kurse
Große MAN-Brummis simuliert auf schnellen Prozessoren – Thermodynamische Verbrennungsmodelle simuliert auf schnellen QuadCore-Prozessoren F. Dengler, MicroNova AG	Einführung in die Schall- und Schwingungsanalyse B. Fasching, National Instruments	What's on the Roadmap? Neue Produkte für RF- und Halbleitertest von National Instruments C. Gindorf, National Instruments	Interaktive Datenverwaltung, -analyse und Berichterstellung mit NI DIAdem
Testmethoden in der Steuergeräte-Entwicklung auf Basis von NI-Software B. Fallnich, ITK Engineering AG	Neue Dimensionen der Schwingungsdiagnose mit PAC – Beispiel Order Tracking Dr. J. Kolerus T. Daub, National Instruments	Fertigungstest von Geräten und Funkmodulen „enabled by EnOcean“ T. Rieder, PROBARE	
HIL Systems for Engine Simulation at Volvo Aero O. Lilja, Prevas AB	Mehrkanalige Erregung von Strukturen mittels elektrodynamischer Shaker zur Modalanalyse Dr. H. Nicklich, SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH	Vorstellung der OKTOPUS Plattform – Eine neue Generation des Halbleitertests M. Konrad, Konrad Technologies GmbH	Grafische FPGA-Programmierung mit NI LabVIEW und NI CompactRIO
Echtzeit-HiL zum Test von Airbag-Steuergeräten Dr. T. Mertke, Bertrandt Ingenieurbüro GmbH	Darf's ein bisschen genauer sein? Einsatz von LabVIEW und PXI-Systemen am Beispiel der Stoß-Beschleunigungs-Normalmessenrichtung H. Volkers, PTB Braunschweig	Untersuchung einer Streuparameter-Testumgebung aus modularen RF-PXI-Instrumenten M. Hrobak, Universität Erlangen-Nürnberg	

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

11:30 – 12:30 Uhr
DIAdem-Anwendertreffen
Neuerungen in DIAdem 11.1

Mittagsbuffet / Besuch der Ausstellung

12:30 – 14:00

Keynote: Rahman Jamal, Technical Director Central Europe, National Instruments
 Live-Demonstrationen neuer Technologien und Produkte aus dem R&D-Center von National Instruments

14:00 – 15:00

Kaffeepause / Besuch der Ausstellung

15:00 – 15:30

Automotive	Schall- und Schwingungsanalyse	Komponenten- und Baugruppentest	Hands-On-Kurse
Automatische Generierung von NI-Test- und NI-Requirement-Gateway-Files aus einer Prüfspezifikation J. Dodek, MTU Friedrichshafen GmbH	Neue akustische Messsysteme mit LabVIEW K.-U. Kohn, CA Engineering & Service GmbH	Navigation system testing with latest URT features – multiple signals record & playback or GPS simulation M. Solbach, NOFFZ ComputerTechnik GmbH E. Frenette, Aversa	Daten erfassen, analysieren und darstellen mit NI LabVIEW
Mehrkanaliges synchrones PXI-CAN- und -Analog-IO-Testsystem für den Test von Steuergeräten P. Schwarz, A.M.S. Software GmbH A. Gemünd, Johnson Controls – SAFT Advanced Power Solutions	Array – Signalverarbeitung zur Lokalisierung von Schallquellen. Ein Vergleich verschiedener Verfahren Prof. Dr. W. Pannert, Hochschule Aalen	Optimizing RFID product tagging by measurements and tests using the NI PXI platform Dr. V. Derbek, CISC Semiconductor Design+Consulting GmbH	
Test- und Prüfmöglichkeiten der SENT-Schnittstelle mit Hilfe eines NI-CompactRIO-Systems K. Nicolai, Volkswagen AG	Akustiktest mechatronischer Automobilkomponenten in Versuch und Fertigung F. Pauli, GÖPEL electronic GmbH	Optimierung eines Halbleitermessplatzes durch den Einsatz von NI FlexRIO J. Hagedorn, NEC Electronics GmbH	Erstellung deterministischer Anwendungen mit NI LabVIEW Real-Time
CAN- und FlexRay-Unterstützung von National Instruments D. Riedelbauch, National Instruments	Architekturen für hochkanalige, verteilte Anwendungen zur Schall- und Schwingungsanalyse I. Schumacher, National Instruments	FPGA-basierter Regelkreis zur Beschleunigung von Lebensdauertests für Smart-Power-Schalter H.-P. Kreuter, KAI Kompetenzzentrum Automobil- und Industrieelektronik GmbH	

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

15:30 – 16:30 Uhr
Podiumsdiskussion
Die Rolle der Software in der Robotik und Mechatronik
Moderation: Ronald Heinze, etz und openautomation

17:30 – 18:30 Uhr
Fragen und Antworten mit dem NI-Management

HAPPY HOUR im Ausstellungsbereich

ab 17:30